より良い品質のために 積層膜断面の精密評価



Detailed evaluation of the multilayer specimen cross section

硬度の異なる積層膜をイオンミリング加工することにより、境界面のボイドや クラックを発生させることなく試料作成でき、高倍率観察が可能となります。 エッチング効果により、金属の結晶状態観察試料の作成が行えます。

By ion milling a multilayer specimen consisting of different hardness layers, preparation of specimen and highresolution observations are enabled without generating voids or cracks in the layer boundary. Also, specimen for observing the metal crystal condition can be prepared owing to etching effect.

イオンミリング加工で積層膜素材の高倍率観察が可能に

日立 IM4000

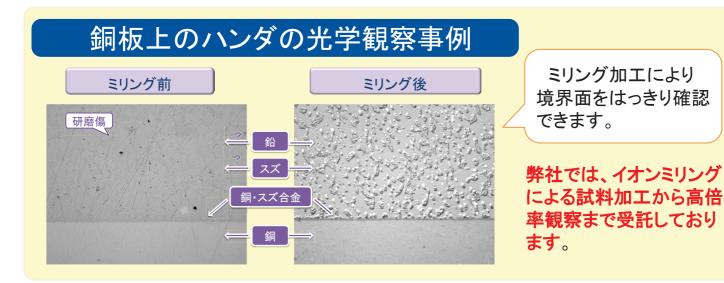


断面ミリング 断面幅:最大2mm 試料サイズ:最大20×12×7mmt

試料の加工

アルゴンイオンビームを試料に照射し、試 料表面の原子を弾き飛ばし、試料に機械的 応力を加えることなく、表面を加工します。 ビームの照射角度により、断面や平面を 加工することが可能です。

素材の硬さが違う積層膜境界のずれ、結晶の変形や微細な研磨 傷等の問題を発生させることなく、高倍率観察が実現されました。



SHIBAURA SEMTEK